



Daitron Chip LaserDiode Tester

本装置は LD チップをローダーからピックアップし、常温と高温状態での各種特性評価を行い、分類する装置です。Pulse または CW 駆動により様々なレーザーダイオードの電氣的及び光学的な測定が可能です。デバイスに応じ最適な計測環境を提供できます。

Key features

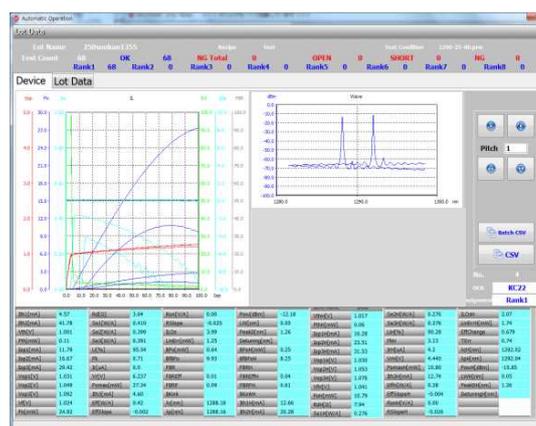
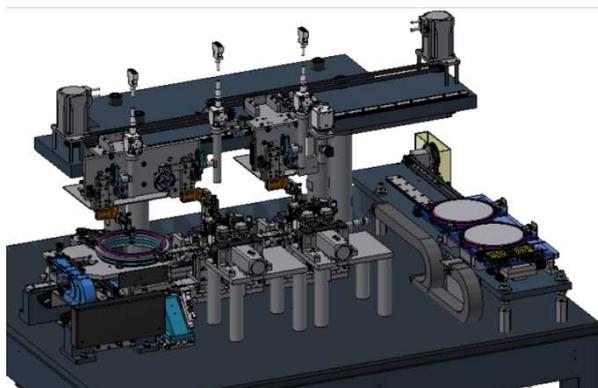
- ▶ 用途に応じ選択可能な通電方式 (CW / Pulse)
- ▶ フロント光・バック光の同時計測が可能
- ▶ 高品質の Pulse 波形出力による印加
- ▶ コンパクトな装置サイズ
- ▶ 常温と高温を 1 回の試験で計測可能
- ▶ デバイスダメージを最小限にした搬送機構



Applications

- ▶ I-L(フロント)測定 [常温]
- ▶ I-L(バック)測定 [常温]
- ▶ I-L(フロント)測定 [高温]
- ▶ I-L(バック)測定 [高温] Option
- ▶ 波長測定 [常温]
- ▶ 波長測定 [高温]
- ▶ EA 変調測定 [常温] Option
- ▶ EA 変調測定 [高温] Option

Equipment Overview



Driver Lineup

Driver Line up	Current	Pulse Width
High Speed Pulse Driver for LD	~1A	2μsec ~

※ドライバは弊社ドライバラインナップよりカスタムオプションにて選択可能です。

Details

装置諸元	
・筐体寸法	1200(W)×1000(D)×1800(H) mm
・ユーティリティ	電源： 三相 200V±10% 30A 1系統 空圧源： 要 真空源： 要
・重量	約 1000kg
標準機能	
・対象デバイス(参考)	LD チップ
・供給形態	6 インチグリップリング(GR-4)
・収納形態	6 インチグリップリング(GR-4)： 2 枚 2 インチゲルパック： 2 枚以上
・電流測定	1A (最大 1A まで仕様に合わせてレンジ変更可)
・パルス幅	5.0~100μs ※波形保証
・パルス周期	0.1~20ms(Duty 最大 50%)
・電圧測定	5V
・光出力測定	30mW/100mW
・波長範囲	1300~1700nm
・温度制御範囲	常温： +20℃~+30℃ 高温： +20℃~+100℃
・タクトタイム(参考)	6.0sec/chip 以下 ※測定条件によって変わります。
・安全機能	オープンショートチェック/フェイルチェック/通電安全チェック 変動監視機能/リミット監視機能
・管理機能	OCR 読取機能
測定機能	
・標準取得データ	IL : Iop / Vop / Ith / Vth / Vf / Pth / Pop / Rd / Se / Li / Pk / Vf / Ir
	λ : λp / λc /SMSR
・オプション	EA : Po / Iea / Vm / 消光比

お問い合わせ先

ダイトロン株式会社 D&P カンパニー 計測機器工場 亀岡 営業担当
〒621-0013 京都府亀岡市大井町並河 3-13-1
TEL 0771-24-1011(代) <http://www.daitron.co.jp>

製品ホームページ
(チップテスタ)



問い合わせ装置番号：DCLT-2300